

TP SdF N° 14

Estimation Bayésienne

Ce TP a pour objet d'estimer la fiabilité de nouveaux équipements en cherchant à minimiser le nombre d'essais dans le cas d'un taux de panne constant (loi exponentielle) et d'un système monocoup (loi de Bernouilli).

Problème 1 :

50 équipements électroniques ont été mis en test pendant 1 an. Un seul est tombé en panne après 0,3 ans.

Quel taux de défaillance à 60% de confiance ce test permet-il de justifier ?

Sachant que le taux de défaillance de ce type d'équipement a été estimé à 1000 fits (10^{-6} hr⁻¹) par la norme MIL HDBK 217 et que le risque que le taux de défaillance réel soit inférieur à 3 fois la valeur de cette estimation est inférieur à 10 % selon un jugement d'expert, de combien peut-on améliorer le résultat du test par estimation bayésienne ?

De quelle durée faudrait-il prolonger le test initial pour obtenir un même résultat en supposant qu'aucune panne supplémentaire ne survienne ?

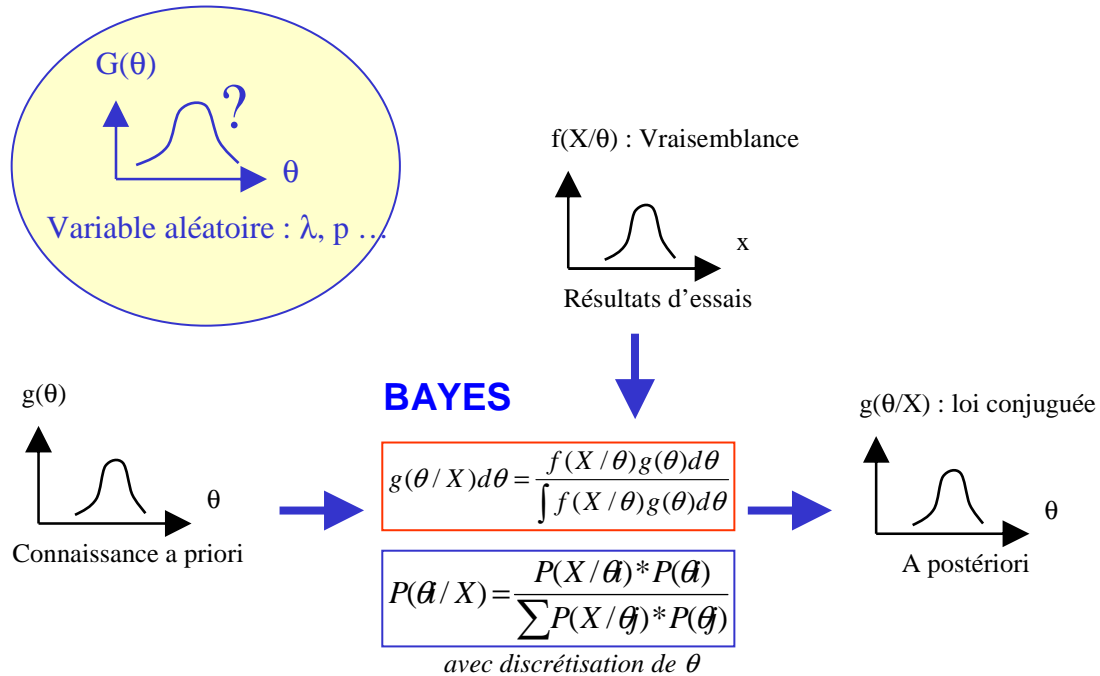
Problème 2 :

Un feu d'artifice de conception nouvelle doit démontrer une probabilité de succès de 95 % à 60% de confiance. Combien d'essais (destructifs) sans défaillance faut-il réaliser pour justifier cette performance ?

Sachant que cette conception résulte de diverses modifications d'un produit en service qui toutes devraient améliorer la fiabilité opérationnelle actuellement égale à 90 % et que les experts consultés garantissent cette amélioration à plus de 70 % de chance, de combien peut-on réduire le nombre d'essais ?

Principe de l'estimation bayésienne

Basée sur la formule de Bayes, l'estimation bayésienne consiste à combiner des données statistiques (résultats d'essais...) avec une connaissance a priori (expériences passées, jugement d'expert, estimations empiriques, etc.).



θ est le paramètre d'une loi de probabilité que l'on cherche à estimer, soit le taux de défaillance λ dans le cas d'une loi exponentielle ou la probabilité d'échec p dans le cas d'une loi de Bernouilli.

La fonction de vraisemblance donne la probabilité de chacun des résultats possibles de l'essai pour une valeur de θ .

Soit la loi de Poisson : $P(k) = \frac{(\lambda T)^k e^{-\lambda T}}{k!}$ avec k le nombre de pannes pendant la durée cumulée T ,

ou la loi Binomiale : $P(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ avec n le nombre d'essais.

La loi conjuguée donne la densité de probabilité de θ sachant qu'un résultat d'essais a été obtenu.

Soit la loi Gamma : $g(\lambda/k, T) = \frac{\lambda^k T^{k+1} e^{-\lambda T}}{k!}$ si k pannes sont survenues pendant la durée cumulée T ,

ou la loi Beta : $g(p/k, n) = \frac{(n+1)!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k}$ si n essais ont conduit à k échec et $n-k$ succès.

Dans les cas de la loi de poisson et de la loi binomiale, l'a priori peut être simplement converti en essai virtuel qui s'ajoute à l'essai réel :

Soit dans le cas de la loi de Poisson : $k = k_0 + k_1 \quad T = T_0 + T_1$

et de la loi binomiale : $k = k_0 + k_1 \quad n = n_0 + n_1$

Problème 1 :

50 équipements électroniques ont été mis en test pendant 1 an. Un seul est tombé en panne après 0,3 ans.

Le taux de défaillance à 60% de confiance que ce test permet de justifier correspond à la borne supérieure de l'intervalle de confiance unilatéral au risque $\alpha = 40\%$

Soit $\frac{\chi^2_{1-\alpha} (2k + 2)}{2T} = \chi^2_{60\%} (4)/(2*49,3*365*24) = 4683 \text{ fits}$ avec $T_1 = 49,3 \text{ ans}$ et $k_1 = 1 \text{ panne}$
 (=KHIDEUX.INVERSE(α ;2*k+2)/(2*T) sous Excel)

Remarque : ce même résultat peut s'obtenir par intégration de la loi conjuguée Gamma :

$$\text{Probabilité } (\lambda \leq \lambda_{\text{sup}}) = 1 - \alpha = \int_0^{\lambda_{\text{sup}}} g(\lambda / k, T) d\lambda$$

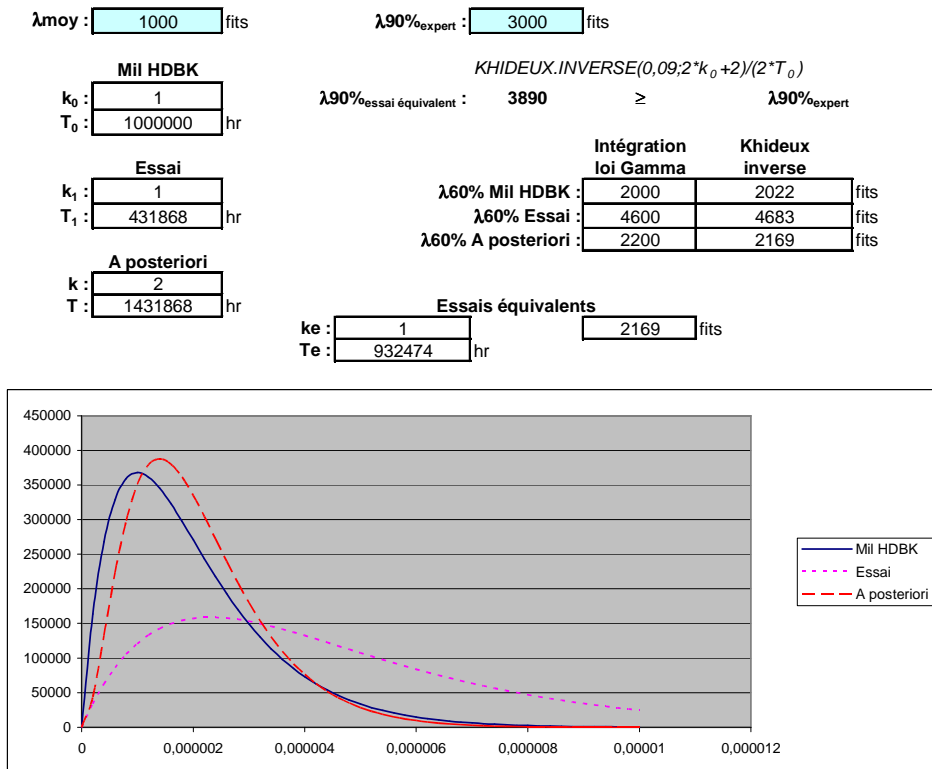
Le taux de défaillance de ce type d'équipement a été estimé à 1000 fits (10^{-9} hr^{-1}) par la norme MIL HDBK 217 et l'on considère que le risque que le taux de défaillance réel soit inférieur à 3 fois la valeur de cette estimation est inférieur à 10 %.

Ce jugement d'expert peut être converti en essais virtuels tels que $\lambda_{\text{moy}} = k_0/T_0 = 1000 \text{ fits}$ et $\lambda_{\text{sup}90\%} \geq 3000 \text{ fits}$.

$$\lambda_{\text{sup}90\%} = \chi^2_{90\%} (2k_0+2) * \lambda_{\text{moy}} / 2 k_0 = 3890 \text{ fits pour } k_0 = 1 \text{ et } 2661 \text{ fits pour } k_0 = 2$$

Seule la configuration $k_0 = 1$ pannes et $T_0 = 1000\ 000$ heures satisfait cette condition.

Les essais virtuels peuvent alors s'ajouter aux essais réels comme le montre la figure ci-dessous (ouverture du fichier Excel sur double clic) :

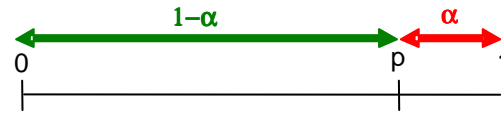


L'estimation bayésienne permet d'obtenir un taux de défaillance de 2169 fits à 60% au lieu de 4683 à l'issue des essais. Un même résultat aurait été obtenu en prolongeant la durée d'essais d'un facteur 2,2 (l'outil d'optimisation Gencab est utilisé dans cette exemple pour effectuer le calcul inverse).

Problème 2 :

Le feu d'artifice doit démontrer une probabilité de succès de 95 % à 60% de confiance. Soit p la probabilité d'échec, la borne supérieure de l'intervalle de confiance unilatéral pour la loi binomiale s'exprime de la manière suivante :

$$\sum_{k=0}^m C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \alpha$$



avec $k_1 = 0$ on obtient $(95\%)^{n_1} \leq 40\%$ soit $n_1 \geq \log(0,4)/\log(0,95) = 18$

En l'absence de défaillance, 18 essais (destructifs) sont à réaliser pour justifier la tenue de l'objectif.

La fiabilité du produit à plus de 70 % de chance de dépasser celle d'un produit actuellement en service dont la fiabilité opérationnelle est égale à 90 %.

Cet avis d'expert peut se traduire en essais virtuels sans échec de la même manière que précédemment :

$$(90\%)^{n_0} \geq 30\% \text{ soit } n_0 \leq \log(0,3)/\log(0,90) = 11$$

Les essais virtuels s'ajoutant aux essais réels, seuls 7 essais supplémentaires sont nécessaires comme l'illustre la figure ci-dessous (ouverture du fichier Excel sur double clic) :

REX	
k_0 :	0
n_0 :	11

Expert	
Taux de défauts :	10%
Confiance :	70%

Essai	
k_1 :	0
n_1 :	7

A posteriori	
k :	0
n :	18

Fiabilité à 60%	
A priori	0,9201
Essai	0,8773
A posteriori	0,9504

